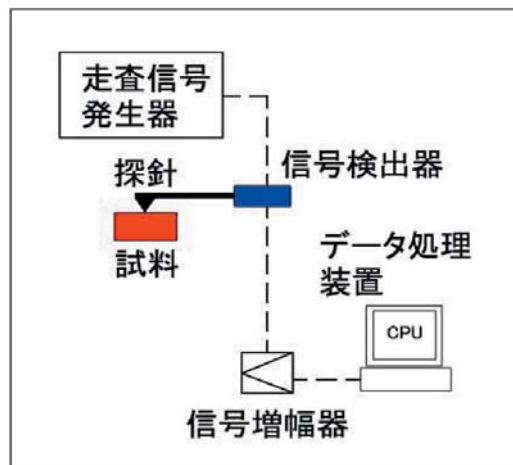


# 走査型プローブ顕微鏡

## Scanning Probe Microscope (SPM)

米 DIGITAL INSTRUMENT社製 Nano Scope IIIa



世界最高分解能を持つプローブ式表面観察装置  
微小プローブで物質表面を走査し、プローブと物質表面  
間で働く力を検出し、ナノ・原子レベルの像観察を行う

1. 機器名称 走査型プローブ顕微鏡
2. 機器分類 形態観察
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科
4. 装置担当者 森本 万里子
5. 導入年度 2004年
6. 型式 Digital Instrument社 Nano Scope (Ⅲa)
7. 仕様・性能 分解能;1nm 以下、試料サイズ;15x15mm、最大スキャン;100x100  $\mu$ m、  
測定モード;トンネル顕微鏡(STM)、タッピング AFM、振幅検出 MFM、コンタクト AFM、  
水平力顕微鏡、フォーカスカーブ、位相イメージング、コンタクトタイプ AFM、磁気力顕微  
鏡、液中測定、加熱測定、
8. 機器の開放状況 (該当する区分を選択して下さい。)
  - ・ 研究指導条件下で、有料で開放している。(8,400 円/1 時間、420 円/1 撮影)
  - ・ 共同研究利用の場合は無料
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例：ナノ微粒子観察、